

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-15047-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 18.08.2020

Ausstellungsdatum: 18.08.2020

Urkundeninhaber:

**GIGAHERTZ Optik Vertriebsgesellschaft für technische Optik mbH
An der Kälberweide 12, 82299 Türkenfeld**

Prüfungen in den Bereichen:

Optik

Dem Prüflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkks bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.

Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.

| Fachbereich | Norm oder Prüfverfahren / Ausgabestand | Titel der Norm oder des Prüfverfahrens | Einschränkungen zum Prüfverfahren |
|-------------|--|--|---|
| Optik | CIE 220:2016 | Characterization and Calibration Methods of UV Radiometers | Prüfung von Schmal- und Breitbandradiometer im Wellenlängenbereich von 200 nm bis 2500 nm |
| | ASTM G130-12 | Standard Test Method for Calibration of Narrow- and Broad-Band Ultraviolet Radiometers Using a Spectroradiometer | |
| | CIE 202:2011 | Spectral responsivity measurement of detectors, radiometers and photometers | |

verwendete Abkürzungen: siehe letzte Seite

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-15047-01-00

| Fachbereich | Norm oder Prüfverfahren / Ausgabestand | Titel der Norm oder des Prüfverfahrens | Einschränkungen zum Prüfverfahren |
|-------------|--|---|---|
| | DIN 5031-11:2009-02 | Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik Teil 11: Radiometer zur Messung aktinischer Strahlungsgrößen- Begriffe, Eigenschaften und deren Kennzeichnung | |
| Optik | ASTM G0138-12 | Standard Test Method for Calibration of a Spectroradiometer Using a Standard Source of Irradiance | Spektralradiometer / Geräte-eigenschaften bei definierter Geräteeinstellung / Prüfung der spektralen Bestrahlungsstärke im Wellenlängenbereich von 200 nm bis 2500 nm |
| Optik | CIE 063:1984 | The Spectroradiometric Measurement of Light Sources | Prüfung der Bestrahlungsstärke von Strahlern, Leuchten und Halbleiterlichtquellen im Wellenlängenbereich von 200 nm bis 2500 nm |
| Optik | CIE 210:2014 | Photometry Using V(lambda)-Corrected Detectors as Reference and Transfer Standards | Beleuchtungsstärke / Lichtmessung Photometer |
| Optik | CIE 084:1989 | The measurement of luminous flux | Lichtstrom von elektrisch betriebenen Strahlern / Messung mit einer Ulbricht'schen Kugel unter Anwendung von Korrekturtechniken / Messung durch Integration der |

| Fachbereich | Norm oder Prüfverfahren / Ausgabestand | Titel der Norm oder des Prüfverfahrens | Einschränkungen zum Prüfverfahren |
|-------------|--|--|--|
| | DIN EN 13032-1:2012-06 | Licht und Beleuchtung - Messung und Darstellung photometrischer Daten von Lampen und Leuchten - Teil 1: Messung und Datenformat; Deutsche Fassung EN 13032-1:2004+A1:2012 | Beleuchtungsstärkeverteilung |
| Optik | CIE 127:2007 | Measurement of LEDs | Lichtstrom von LED / Messung mit einer Ulbricht'schen Kugel unter Anwendung von Korrekturtechniken |
| Optik | CIE 063:1984 | The Spectroradiometric Measurement of Light Sources | Spektraler Strahlungsfluss (Strahlungsleistung) im Wellenlängenbereich von 350 nm bis 1050 nm |
| Optik | CIE 063:1984 DIN EN 13032-1:2012-06 | The Spectroradiometric Measurement of Light Sources Licht und Beleuchtung - Messung und Darstellung photometrischer Daten von Lampen und Leuchten - Teil 1: Messung und Datenformat; Deutsche Fassung EN 13032-1:2004+A1:2012 | Leuchtdichte und spektrale Strahldichte im Wellenlängenbereich von 250 nm bis 2500 nm |

verwendete Abkürzungen:

DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
CIE Commission Internationale de L'Eclairage